

Mardi 24 mai 2016 matin

8h30 - 9h00	Accueil des participants
9h00 - 9h20	Ouverture de la conférence
9h20 - 10h00 invité	Surfaces et Biofilms : Contrôle et croissance ? <i>Claire-Marie Pradier</i> Laboratoire de Réactivité de Surface - UMR CNRS 7197 - SORBONNE Université - Université Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, France.
10h00 - 10h20	Modifications de la couche passive d'un acier inoxydable lors des premières étapes de formation d'un biofilm <i>Sandrine Zanna¹, Audrey Allior², Antoine Seyeux¹, Philippe Marcus¹</i> ¹ PSL Research University, Chimie ParisTech-CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris, Research Group Physical Chemistry of Surfaces, 11 rue Pierre et Marie Curie, F-75005 Paris, France ² Aperam Isbergues, Corrosion & Surface Dept., BP 15, F-62330 Isbergues, France
10h20 - 10h40	Potentialités des spectroscopies d'électrons pour la caractérisation de nanoparticules hybrides cœur-coquille dédiées à la nanomédecine <i>S. Soulé¹, J. Allouche¹, A. Uhart¹, J.-B. Ledeuil¹, J.-C. Dupin¹, H. Martinez¹</i> ¹ IPREM-ECP CNRS UMR-5254, Technopole Hélioparc, 2 avenue du Président Pierre Angot- 64053 Pau cedex 09
10h40 - 11h00	Pause-café
11h00 - 11h20	XPS characterization of H_{3+x}PMo_{12-x}V_xO₄₀ heteropolyacids supported on mesoporous HMS, CMI-1 and SBA-15 <i>Siham BENADJI¹, Pierre ELOY², Alexandre LEONARD^{3,4}, Bao-Lian SU³, Chérifa RABIA¹ and Eric M. GAIGNEAUX²</i> ¹ Laboratoire de Chimie du Gaz Naturel, Faculté de Chimie, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène (USTHB), BP 32, El-Alia, 16111 Bab-Ezzouar, Alger, Algeria ² Institute of Condensed Matter and Nanosciences (IMCN) – Division Molecules – Solids and Reactivity (MOST), Croix du Sud 2/17, UCL, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium ³ Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques (CMI), I.S.I.S, FUNDP, 61 rue de Bruxelles, B-5000 Namur, Belgium ⁴ Laboratoire de Génie Chimique, B6a, Université de Liège, B-4000 Liège, Belgium
11h20 - 11h40	ETUDE DES PROPRIETES ELECTRONIQUE DE NANOPARTICULES Ni/MgO PAR (XPS) <i>N. Ouafek^{1,2}, N. Keghouche¹, H. Dehdouh², C. Untid³</i> ¹ Laboratoire microstructure et défauts dans les matériaux, Université Mentouri Constantine, Ain El Bey, 25000 Constantine, Algérie. ² Unité de Développement des Couches Minces et Applications (U.D.C.M.A) Sétif / Centre de Recherche en Technologies Industrielles (CRTI) / BP 64 Cheraga / Algérie.
11h40 - 12h00	Une présentation orale courte des posters traitant des problématiques de corrosion par les techniques d'électrochimie sera suivie de discussions permettant d'évaluer ce que pourrait-être l'apport des techniques de spectroscopie d'électrons
12h00 - 12h20	Une nouvelle génération d'analyseur d'électrons hémisphérique dans les nouvelles sciences des surfaces <i>C. Kirschfeld^{1*}</i> ¹ Département Recherche et Développement, PREVAC Sp. z o.o., Rogów, Pologne - *E-mail: c.kirschfeld@prevac.eu
12h30 - 14h00	repas

Mardi 24 mai 2016 après-midi

14h00 – 14h40
invité

« Caractérisation de surfaces de catalyseurs en conditions quasi *in situ* »

Pierre Delichère
Institut de Recherches sur la Catalyse et l'Environnement de Lyon - IRCELYON - CNRS Université
Claude Bernard Lyon 1 - 2, avenue Albert Einstein - 69626 Villeurbanne cedex

14h40 – 15h00

Etude XPS de l'insertion de Nickel dans une matrice copolymérique

Pierre Eloy¹, Benjamin Farin¹, Eric M. Gaigneaux¹
1 Institute of Condensed Matter and Nanosciences – MOST Division and Surface Characterisation Platform
(SUCH), Université Catholique de Louvain, Croix du Sud 1/L7.04.01, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium

15h00 – 15h20

Apport de l'UPS (Ultraviolet Photoemission Spectroscopy) pour l'étude de la jonction métal/TiO₂ : Conséquences sur la production d'hydrogène par photocatalyse.

L. Cardenas, K. Rattabal, C. Geantet, P. Afanasiev, E. Puzenat
IRCELYON-CNRS, 2 Av. A. Einstein, 69626 Villeurbanne, France.

15h20 – 15h40

Examination of Pit Initiation at MnS Nano-inclusions in Carbon Steel using Auger Electron Spectroscopy

J.G. Newman¹, J.S. Hammond¹, B. H. Davis², Z. Suo², I. Beech³, D. F. Paul¹, and R. Avci²,
1. Physical Electronics, Chanhassen, MN 55317, USA
2. Montana State University, Bozeman, MT 59717, USA
3. University of Oklahoma, Norman, OH 73019, USA

15h40 – 16h00

Session Poster

16h00 – 16h20

Pause-café

16h20 – 16h40

Preparation and Characterization of Copper Niobate as a Novel Photocatalyst in Hydrogen Generation

N. Belmokhtar^{1,2}, R. Brahimi³, **R. Nedjar**¹, M. Trari³
¹Laboratory of Materials Sciences, Faculty of Chemistry, U.S.T.H.B., Algiers, Algeria
²Institute of Electrical and Electronic Engineering, U.M.B.B., Boumerdes, Algeria
³Laboratory of Storage and Valorization of Renewable Energies, Faculty of Chemistry, U.S.T.H.B., Algiers, Algeria

16h40 -17h00

Nanoparticles CoPt's synthesis deposited on the surface Au (677)

Awatef LARIBI, ChaabaneCheffi, AbdelwahabAkremi, Laurent Bardotti, Florent Tornus
(1) Université de Carthage, Laboratoire de Physique des matériaux, Unité Spectromètre de surfaces, Faculté des sciences de Bizerte, 7021 Jarzouna, Bizerte, Tunisia.
(2) Institut Lumière Matière, UMR5306 Université Lyon 1-CNRS, Université de Lyon, 69622 Villeurbanne

17h00 – 18h00

Une table ronde est prévue pour discuter, structurer puis mettre en place ce que pourraient être les développements des relations entre les différentes équipes de recherches au travers des thèmes instrumentaux ou matériaux.

Mercredi 25 mai 2016 matin

8h30 - 9h00	Accueil des participants
9h00 - 9h40 invité	<p>Les matériaux pour l'énergie et le stockage d'énergie : Les avancées en XPS – des spectres des niveaux de cœur aux spectres de valence Danielle GONBEAU IPREM (ECP) – UMR5254 (CNRS - Université de Pau et des Pays de l'Adour) – 2, Avenue P. Angot, 64053 PAU, Cedex 9 France</p>
9h40 - 10h00	<p>Interface nanoparticules de métal - carbone: de la physico-chimie de base aux catalyseurs Pt/C Yan Busby¹, Alexandre Felten¹, Michal Gulas¹, Mathilde Laurent-Brocq¹, Ludovic Devant¹, Nathalie Job², Jean-Jacques Pireaux¹ 1 : Université de Namur, Centre de recherche en Physique de la Matière et du rayonnement (PMR - LISE), 61, rue de Bruxelles, 5000 - Namur (Belgique) 2 : Université de Liège, Département d'Ingénierie Chimique, NCE (Nanomaterials, Catalysis, Electrochemistry), Sart-Tilman, 4000 Liège (Belgique)</p>
10h00 - 10h20	<p>Mécanismes aux interfaces de batteries « tout solide » LiCoO₂ / Li₆PS₅Cl / Li₄Ti₅O₁₂. Etude par XPS Jérémy Auvergniot^{a,b}, Alice Cassel^b, Dominique Foix^{a,c}, Virginie Viallet^{b,c}, Vincent Seznec^{b,c}, Rémi Dedryvère^{a,c} ^a IPREM, CNRS – Université de Pau et des Pays de l'Adour ^b LRCS, CNRS – Université de Picardie Jules Verne ^c Réseau sur le Stockage Electrochimique de l'Energie (RS2E), FR CNRS 3459</p>
10h20 – 10h40	<p>State-of-the-art 2D-CCD/3D-Spin VLEED detector for PHOIBOS electron analyzers SPECS presentation technique ELSPEC 2016</p>
10h40 – 11h00	Pause-café
11h00 – 11h40 invité	<p>«Surfaces défectives d'oxydes» Jacques JUPILLLE Sorbonne Universités – UPMC, CNRS UMR 7588, Institut des NanoSciences de Paris, F-75005 Paris, France</p>
11h40 – 12h00	<p>Analyse de surfaces et d'interfaces d'oxydes perovskites (LaAlO₃/SrTiO₃) par profilage XPS utilisant des ions argon monoatomiques et cluster K. Ridier^{1,2}, D. Aureau², B. Bérini¹, J. Vigneron², N. Keller¹, A. Etcheberry², Y. Dumont¹, A. Fouchet¹ 1 <i>Groupe d'Étude de la Matière Condensée (GEMaC) UMR 8635 CNRS-UVSQ, Université Paris-Saclay, Versailles, France.</i> 2 <i>Institut Lavoisier (ILV), UMR 8180 CNRS-UVSQ, Université Paris-Saclay, Versailles, France</i></p>
12h00 – 12h20	<p>Enhancing Surface and Thin Film Analysis through In-Situ Complementary Spectroscopies Tim Nunney and Richard G. White. Thermo Fisher Scientific, East Grinstead, West Sussex, UK</p>
12h30 – 14h00	repas

Mercredi 25 mai 2016 après-midi

- 14h00 – 14h20 **Comportement d'une surface isolante sous irradiation électronique**
M. Ghamnia, A. Loukil et A. Aissat
Laboratoire LSMC, Université d'Oran 1 Ahmed Benbella, 31100, Oran Algérie
- 14h20 – 14h40 **Etude microstructurale de composés ZrB₂-SiC fibre UHTC traités à hautes températures par voie solaire**
E. Beche^{1*}, M. Balat-Pichelin¹, V. Flaud², J. Esvan³, D. Perarnau¹, D. Sciti⁴, D. Alfano⁵
1 PROMES Odeillo, CNRS UPR 8521, 7 rue du Four Solaire, 66120 Font-Romeu, France
2 ICGM, UMR 5253, Place Eugène Bataillon, CC1701, 34095 Montpellier Cedex 5, France
3 CIRIMAT-ENSIACET, 31030 Toulouse Cedex 4, France
4 ISTECCNR, 64 via Granarolo, 48018 Faenza, Italy
5 CIRA, via Majorise, 81043 Capua, Italy
- 14h40 – 15h00 **Evaluation de rejets moyen-terme en situation accidentelle grave d'un Réacteur à Eau Pressurisée (REP) : étude expérimentale de la re-vaporisation de dépôts de produits de fission (Cs, I, Ru)**
D. Obada^{1,3}, A.-S. Mamede², A.-C. Grégoire¹, L. Gasnot³
1 Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire, Pôle Sécurité Nucléaire, CEN Cadarache 13115 Saint-Paul-lès-Durance France
2 Université de Lille, UCCS UMR 8181, Bâtiment C3, 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex France
3 Université de Lille, PC2A UMR 8522, Bâtiment C11, 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex France
- 15h00 – 15h20 **The correlation between optical and magnetic properties of Co doped ZnO thin films**
O. Karzazi^{1,2}, E.K. Hlil³, A. Chahboun^{1,4} and M.J.M. Gomes¹
¹Centre of Physics, University of Minho, Braga, 4710-057, Portugal
²LPS, Physics Department, Faculty of Sciences, BP 1796, FES, Morocco
³Institut Néel, CNRS, Université J. Fourier, BP 166, 38042 Grenoble, France
⁴FST Tanger, Physics Department, BP416, Tangier, Morocco
- 15h20 – 15h40 **New Developments in X-ray Photoelectron Spectroscopy from Kratos Analytical. Développements récents en Spectroscopie de Photoélectrons X de Kratos Analytical**
CJ Blomfield, Kratos Analytical Ltd www.kratos.com
C Dubegny, Neyco christophe.dubegny@neyco.fr
- 15h40 – 16h00 **Pause-café**

16h00 – 16h20
invité

Les sulfures dans la corrosion anoxique du fer. Rôle, identification et origine de formation : approche multi-techniques du micro au nano»

F. MERCIER-BION

LAPA-IRAMAT, NIMBE, CEA, CNRS, Université Paris-Saclay, CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, France

16h20 – 16h40

Elaboration et qualification par XPS, nano-AES, MEB-EDS de standards spécifiques pour l'optimisation de l'analyse chimique par RBS de matériaux du patrimoine

Muriel Bouttemy¹, Elise Delbos², Hanane El Belghiti², Charles Roux^{1,3}, Marie Radeport^{3,4}, Laurianne Robinet⁴, Arnaud Etcheberry¹, Claire Pacheco^{3,5}

1 Institut Lavoisier de Versailles (ILV), UMR CNRS-UVSQ 8180, 45 avenue des Etats-Unis, 78035 Versailles, France.

2 KMG Ultra Pure Chemicals, Les Vieilles Hayes, 50620 Saint-Fromond, France.

3 AGLAE-C2RMF, Palais du Louvre, 14 quai F. Mitterrand, 75001 Paris, France.

4 Centre de recherche sur la conservation (CRCC, MNHN), USR3224 CRC, 36 rue Geoffroy St Hilaire, 75005 Paris, France.

5 FR 3506 New AGLAE CNRS-MCC, 14 quai F. Mitterrand 75001 Paris, France

Comparative study of nickel-cobalt deposit behavior plated by continuous and pulsed currents from a sulfate bath

Imen Kharmachi^{a,b}, Leila Dhouibi^a, Patrice Berçot^b, El-Mustafa Rezrazi^b

16h40 – 17h00

^a Unité de recherche Mécanique-Energétique, Equipe Corrosion et Protection des Métalliques, ENIT, Université de Tunis El-Manar, BP 37, Tunis Belvédère, 1002, Tunisia

^b Institut UTINAM, CNRS UMR 6213, Université de Franche-Comté, 16 route de Gray, 25030 Besançon Cedex, France

17h00 – 17h20

Quantitative chemical state analysis with high energy resolution spectra by AES

M. Tsutsumi

Jeudi 26 mai 2016 matin

8h30 - 9h00	Accueil des participants
9h00 - 9h40 invité	ARPES : Mesurer le vecteur d'onde des électrons par la spectroscopie de photoémission résolue en angle. Julien RAULT - Synchrotron Soleil – Ligne CASSIOPEE
9h40 - 10h00	Nouvelle méthode de détermination de la fonction de correction d'un analyseur hémisphérique et applications en XPS et EPES G. Monier ^{1,2} , M.A. Mahjoub ^{1,2} , C. Robert-Goumet ^{1,2} , L. Bideux ^{1,2} and B. Gruzza ^{1,2} 1 - Clermont Université, Université Blaise Pascal, Institut Pascal, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand 2 - CNRS, UMR6602, IP, F-63171 Aubière
10h00 - 10h20	Impact de la profondeur d'échappement des photoélectrons sur la quantification des spectres XPS : Cas concret du choix des photopics de CIGS Anais Loubat ¹ , Muriel Bouttemy ¹ , Mathieu Frégnaux ¹ , Sofia Gaiaschi ² , Damien Aureau ¹ , Jackie Vigneron ¹ , Tim Nunney ³ , Patrick Chapon ² , Richard White ³ , Arnaud Etcheberry ¹ ¹ Institut Lavoisier de Versailles, UMR CNRS-UVSQ 8180, 45 avenue des Etats-Unis, 78035 Versailles. ² HORIBA Jobin Yvon, 16 rue du Canal, 91160 Longjumeau. ³ Thermo Fisher Scientific, The Birches Industrial Estate, Imberhorne Lane, East Grinstead, UK.
10h20 - 10h40	Analyse de l'extrême surface de nanoobjets isolés par XPS Olivier Sublemontier [£] , Safia Benkoula [§] , Damien Aureau [¥] , Christophe Nicolas [§] , Minna Patanen [§] , Harold Kintz [£] , Xiaojing Liu [§] , Marc-André Gaveau [£] , Jean-Luc Le Garrec [£] , Emmanuel Robert [§] , Flory-Anne Barreda ^{£,§} , Arnaud Etcheberry [£] , Cécile Reynaud [£] , James B. Mitchell [£] and Catalin Miron [§] . [£] NIMBE-UMR 3685/CEA/CNRS/Université Paris-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette cedex, France, [§] Synchrotron SOLEIL, L'Orme des Merisiers, Saint-Aubin, BP 48, 91192 Gif-sur-Yvette Cedex, France, [¥] Institut Lavoisier de Versailles, UMR CNRS 8180, 78035 Versailles, France [£] Institut de Physique de Rennes, Université Rennes 1, 35042 Rennes, France
10h40 - 11h00	Pause-café
11h00 - 11h20	Tout ce que nous pouvons apprendre des nano-objets au-delà du graphène, en utilisant le nano-microscope d'ARPES Antoine Boury, José Avila, Chaoyu Chen, Stéphane Lorcyand, María C. Asensio - Synchrotron OLEIL & Université Paris Saclay L'Orme des Merisiers, Saint Aubin - P48, 91192 Gif sur Yvette Cedex, France.
11h20 - 11h40	Etude de solutions de transfert et de stockage des wafers entre les différentes étapes de la chaîne de production en microélectronique B. Pelissier ^{1,2*} , S. Labau ^{1,2} , M. Martin ^{1,2} , J. Moeyaert ^{1,2} , C. Beitia ^{1,3} , T. Baron ^{1,2} ¹ Univ. Grenoble Alpes, F-38000 Grenoble, France ² CNRS, LTM, MINATEC Campus, F-38054 Grenoble, France ³ CEA, LETI, MINATEC Campus, F-38054 Grenoble, France
11h40 - 12h00	L'interface SrRuO3/BaTiO3 en fonction de la polarisation ferroélectrique, analysée par HAXPES operando S. Gonzalez ¹ , C. Mathieu ¹ , J. E. Rault ² , D. Ceolin ² , J.-P. Rueff ² , T. Maroutian ³ , G. Agnus ³ , V. Pillard ³ , C.M. Schneider ⁴ and N. Barrett ¹ 1 SPEC, CEA, CNRS, Université Paris Saclay, CEA Saclay, 91191 Gif sur Yvette cedex 2 Synchrotron-SOLEIL, BP 48, Saint-Aubin, F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex 3 Institut d'Electronique fondamentale, Université Paris-Sud, Batiment 220, 91405 Orsay 4 Peter Grünberg Institute (PGI-6) & JARA-FIT, Research Center Jülich, D-52425 Jülich, Germany
12h00 - 12h20	Présentation JEOL
12h30 - 14h00	repas

JEUDI 26 MAI 2016 Après-midi

14h00 – 14h40
invité

Large gas clusters for damageless molecular depth-profiling: Fundamentals, successes and challenges

Arnaud DELCORTE
Université Catholique de Louvain (UCL) – Institut de la Matière Condensée et des Nanosciences (IMCN) – B-1348, Louvain-la-Neuve, Belgium

14h40 – 15h00

Influence du bombardement ionique sur la réponse électrochimique d'un semi-conducteur III-V

D. Aureau, A.-M. Gonçalves, A. Etcheberry
Institut Lavoisier (ILV), UMR 8180 CNRS-UVSQ, Université Paris-Saclay, Versailles, France

15h00 – 15h20

Etude XPS de la ré-oxydation de films de Nichrome dans la chambre d'analyse lors du profilage séquentiel par érosion.

F. Georgi¹, R. Macabies¹, M. Bouttemy², D. Aureau², K. Inal¹
¹ MINES ParisTech, PSL Research University CEMEF - Centre de Mise en Forme des Matériaux, UMR CNRS 7635, rue Claude Daunesse, 06904 Sophia Antipolis Cedex, France
² ILV, Institut Lavoisier de Versailles, UMR 8180, Université de Versailles-St-Quentin, 45 avenue des Etats Unis, 78000 Versailles, France

15h20 – 15h40

Métallisation Ni/Cu pour les cellules solaires en silicium : élaboration et caractérisation

Hanane EL BELGHITI^{1,2}, Damien AUREAU², Elise DELBOS^{1,2}, Dimitri Mercier^{1,2}, Muriel BOUTTEMY² and Arnaud ETCHEBERRY²
¹ KMG Ultra Pure Chemicals, Les Vieilles Hayes, F-50620 Saint-Fromond, France
² Institut Lavoisier de Versailles (ILV), UMR CNRS-UVSQ 8180, 45 avenue des Etats-Unis, 78035 Versailles, France.

15h40 – 16h00

Pause-café

16h00 – 16h20

Sur le profilage de couches organiques et/ou polymères en spectroscopie de photoélectrons XPS

Laurent Nittler, Yan Busby, Pierre Louette et Jean-Jacques Pireaux
Université de Namur, Centre de recherche en Physique de la Matière et du Rayonnement (PMR - LISE), 61, rue de Bruxelles, 5000 - Namur (Belgique)

16h20 – 16h40

MATÉRIAUX & NANOMATÉRIAUX : CARACTÉRISATION PAR SPECTROSCOPIE OPTIQUE DE PRODUITS DE PULVÉRISATION

A. Kaddouri^{*}, L. Jadoual¹, R. Jourdani¹, A. Afkir¹, A. El Boujlaidi¹, M. Ait El Fqih¹,
¹ Equipe de Spectroscopie & Imagerie Atomiques des Matériaux, Université Cadi Ayyad, Marrakech, MAROC
² Equipe Modélisation & Simulation des Structures en Génie Civil, ENSAM, Université Hassan II, Casablanca, MAROC

16h40 – 17h00

Compréhension des interactions plasma-surface lors de la synthèse ALD de matériaux de type oxy-sulfures par analyse XPS

Cathy Bugot¹, Muriel Bouttemy², Nathanaëlle Schneider¹, Arnaud Etcheberry², Daniel Lincot¹ et Frédérique Donsanti¹
¹ Institut de Recherche et Développement sur l'Energie Photovoltaïque (UMR 7174, 1 EDF-CNRS-Chimie Paristech), IPVF, Chatou, FRANCE.
² Institut Lavoisier de Versailles, UMR 8180 (CNRS-UVSQ), Versailles, France.

19h00

Dîner de la conférence

Vendredi 27 mai 2016 matin

8h30 - 9h00

Accueil des participants

9h00 - 9h40
 invité

De l'importance des surfaces et interfaces pour le développement des matériaux et processus pour les dispositifs semi-conducteurs et photovoltaïques : Avantages et limitations de la photoémission

Thierry CONARD
 Institut de microélectronique et composants (IMEC) Louvain – Belgique

9h40 - 10h00

Profilage XPS de Cellules Photovoltaïques: Ségrégation et Chimie d'Interface

Y. Busby¹, F. Kolb², E. J.W. List-Kratochvil³, J.-J. Pireaux¹

¹ Université de Namur, Centre de recherche en Physique de la Matière et du Rayonnement (PMR - LISE), rue de Bruxelles 61, 5000 - Namur (Belgique)

² NanoTecCenterWeizForschungsgesellschaftmbH, Franz-Pichler-Strasse 32, 8160 Weiz, Austria

³ Institut für Physik, Institut für Chemie, and IRIS Adlershof, Humboldt-Universität zu Berlin, Brook-Taylor-Strasse 6, 12489 Berlin, Germany

10h00 - 10h20

Etude du Dopage de Graphène Epitaxial sur SiC(0001) par Spectroscopies de Photoélectrons

David Alamarguy, Hakim Arezki, Fethullah Gunes, Jean-Paul Kleider, Mohamed Boutchich, Alexandre Jaffré, José Alvarez

GeePs, CNRS UMR8507, CentraleSupélec, Univ Paris-Sud, Sorbonne Universités-UPMC Univ Paris 06, 11 rue Joliot-Curie, Plateau de Moulon, 91192 Gif-sur-Yvette Cedex, France

Department of Materials Science and Engineering, Izmir Kâtip Çelebi University Cigli Main Campus, 35620, IZMIR, Turkey

10h20 – 10h40

Contrôle de la chimie de surface du nitrure de silicium déposé par magnétron: décapage par différents traitements en voie liquide.

Marine Brunet, Damien Aureau, Arnaud Etcheberry, François Guillemot, François Ozanam, Anne-Chantal Gouget-Laemmel

Physique de la Matière Condensée, Ecole Polytechnique-CNRS, 91128 Palaiseau Saint-Gobain Recherche, 39 quai Lucien Lefranc, 93303 Aubervilliers Institut Lavoisier, UMR 8180, UVSQ-CNRS, 78035 Versailles,

10h40 – 11h00

Pause-café

11h00 – 11h20

Analyse par XPS d'empilements métal/oxyde et corrélation des décalages d'énergie de liaison aux tensions de seuil

Charly Fontaine¹, Bernard Pelissier², Mickaël Gros-Jean¹, Thierry Chevolleau²

¹ STMicroelectronics, 830 rue Jean Monnet, 38920 Crolles

² Univ. Grenoble Alpes; CNRS, CEA-LETI Minatec, LTM, F-38054 Grenoble Cedex

11h20 – 11h40

Nanosonde Auger : analyse élémentaire quantitative à l'échelle nanométrique.

E. Martinez, W. Hourani, V. Gorbenko, J.-P. Barnes, R. Cipro, J. Moeyaert, F. Bassani, T. Baron

1 Univ. Grenoble Alpes, F-38000 Grenoble, France CEA, LETI, MINATEC Campus, F-38054 Grenoble,

2 Institut FEMTO-ST, Université de Franche-Comté, CNRS, ENSMM, 25000 Besançon, France

3 Univ. Grenoble Alpes, LTM, CNRS, F-38000 Grenoble, France

Signatures XPS et Nano-Auger de la désoxydation absolue d'une surface d'absorbeur photovoltaïque de type CIGS

11h40 – 12h00

Anais Loubat¹, Muriel Bouttemy¹, Mathieu Frégnaux¹, Sofia Gaiaschi², Damien Aureau¹, Jackie Vigneron¹, Patrick Chapon², Arnaud Etcheberry¹

¹ Institut Lavoisier de Versailles (ILV), UMR CNRS-UVSQ 8180, 45 avenue des Etats-Unis, 78035 Versailles.

² HORIBA Jobin Yvon, 16 rue du Canal, 91160 Longjumeau.

Profilométrie chimique par pARXPS et MEIS, et applications aux matériaux de grille des technologies CMOS avancées

12h00 – 12h20

L. Fauquier^{1,2,3*}, B. Pelissier^{2,3}, D. Jalabert^{2,4}, F. Pierre^{2,5}, R. Gassilloud^{2,5}, J.M. Hartmann^{2,5}, D. Doloy¹, C. Beitia^{2,5} and T. Baron^{2,3}

¹STMicroelectronics, 850 Rue Jean Monnet, 38926 Crolles, France

²Univ. Grenoble Alpes, F-38000 Grenoble, France

³CNRS, LTM, MINATEC Campus, F-38054 Grenoble, France

⁴CEA, INAC (SP2M/LEMMA), F-38000 Grenoble, France

⁵CEA, LETI, MINATEC Campus, F-38054 Grenoble, France

12h30 – 14h00

repas

14h00 – 14h20

Clôture de la conférence.